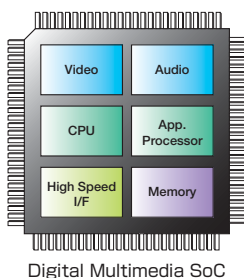


Parallel Test Solution

for Multiple Market Segments

あらゆるSoCデバイスにおいて、お客様のニーズに適したモジュールで、最適かつ自由度の高いテスト・ソリューションを提供いたします。



モジュール構成例

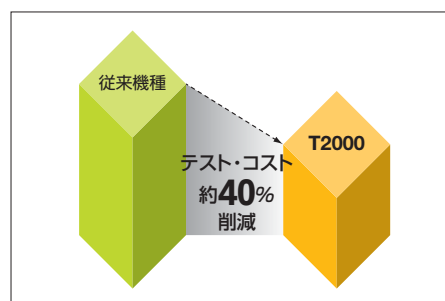
- 6.5Gデジタル・モジュール
- 800Mデジタル・モジュール
- AAWGD (オーディオ)
- BBWGD (ベースバンド/ビデオ)
- DPS500mA
- LCDPS



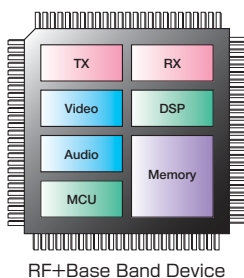
Digital Consumer Test Solution

拡張性と柔軟性

拡張性の高い52 slotsテスト・ヘッドとLSメイン・フレームの組み合わせにより、あらゆるSoCデバイスの同時測定に対応。豊富なハードウェア・リソースによる同時測定効率の向上と、最先端の高密度実装による装置コストの低減により、大幅な投資削減が可能。

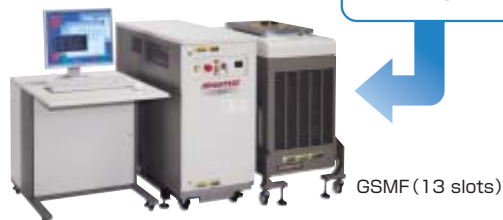


*弊社テスト・コスト・モデルに基づく



モジュール構成例

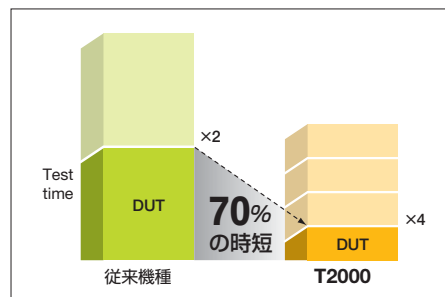
- 250MDMA
- 12GWSGA
- DPS500mA
- AAWGD
- BBWGD

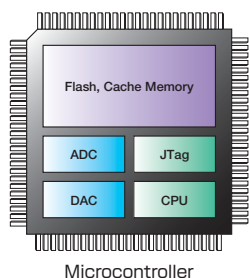


RF Test Solution

独立したRFリソース (32pin, VSG/VSA) により完全同時測定を実現し、量産時のテスト・コストの削減に貢献。

デバイス当たり70%の時短を実現





モジュール構成例

- 250MDMA
- PMU32
- DPS500mA
- 2048ch Frog Unit
- Option:
- AAWGD

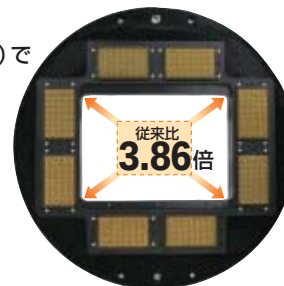
LSMF (26 slots)

MCU Test Solution

AD/DA、Flash Memoryを内蔵するMCUのテストに求められる機能をシンプルなモジュール構成で完全にカバー。

豊富なチャンネルリソースと新開発のFrog Unitにより、MCUの超多数個同時測定を実現。

エリア拡大 (178×253mm) で同時測定数増大をサポート



2048ch Frog unit

■ T2000——多様化・複雑化するテスト・ニーズにモジュール・アーキテクチャで対応

800MDM (800/500Mbps)

- 250MDMA (250Mbps)
- 128 I/O pins per module
- SCAN Test Function
- Memory Test Function
- High Voltage Digital Pin
- Source Synchronous Tests (800MDM only)
- Multi Time Domain
- Histogram Engine (250MDMA only)

12GWSGA

- 4VSG/4VSA x 4MUX per module
- VSG: 6GHz, VSA: 12GHz
- High C/N Mode and High Speed Settling Mode

AAWGD for Audio

- Audio AWG
- 8 AWG ch per module (4 L/R pair)
- 24bit/200Ksps
- Audio DGT
- 8 DGT ch per module (4 L/R pair)
- 18bit/820Ksps (20bit/51Ksps)

BBWGD for BaseBand, Video

- BaseBand AWG
- 8 AWG ch per module (4 I/Q pair)
- 16bit/400Msps
- BaseBand DGT
- 8 DGT ch per module (4 I/Q pair)
- 16bit/128Msps
- Hardware DSP Engine

6.5GDM (6.5Gbps)

- Differential 8I + 8O per module
- Header Hunt Function for Non-deterministic Latency
- Clock Data Recovery for Embedded Clock Interfaces
- Clock Tracking Mode for Source Synchronous Interfaces

Device Power Supply

LCDPS

- 8ch per module
- 4A Maximum Output

HCDPS

- 4ch per module
- 16A Maximum Output

DPS500mA

- 32ch per module
- 500mA Maximum Output

PMU32 for ADC/DAC

- 32 DC pins per module
- High Speed DC Linearity Test
- Wide Coverage of Voltage Range (±0.7V to ±40V)
- 200mA Maximum Output

■ T2000メインフレーム・ラインナップ

	SPMF	MSMF	LSMF	GSMF
搭載モジュール数(最大)	52	52	52/26	13
MFサイズ(W×D×H) mm	1550×1050×2000	900×1050×1900	800×1050×1600	450×1000×960
サイト・コントローラ数(最大)	8	1	4	1
冷却方式	空冷/水冷			空冷

*搭載モジュール数は、水冷モジュール(24mm)換算

- OPENSTARは、米国、日本およびその他の国における登録商標です。
- 本製品を正しくご利用いただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書をお読み下さい。
- 本カタログ記載の製品仕様および外観等は、予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

ADVANTEST

<http://www.advantest.co.jp>

株式会社アドバンテスト

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目6番2号 新丸の内センタービルディング TEL:03-3214-7500 (代)

第1販売部(本社) TEL:03-3214-7501 (大分オフィス) TEL:097-555-9570 第2販売部(西事務所) TEL:06-6368-9280 (名古屋オフィス) TEL:052-731-5990